

# Industry-5.0Jに資する次世代計測-評価-解析技術の開発

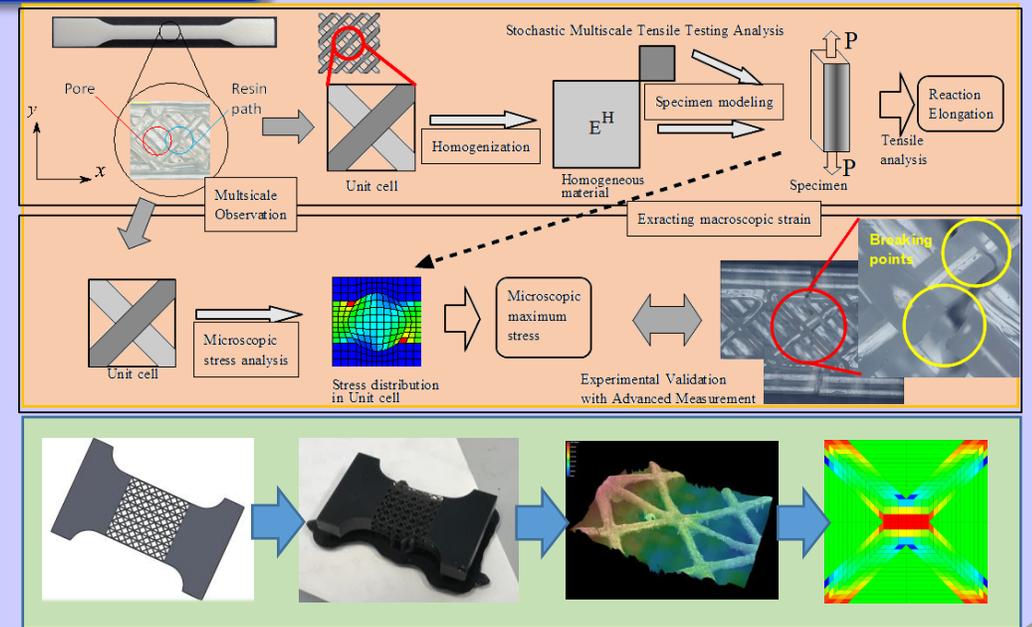
(准教授・大坪義一, ohtsubo@mech.kindai.ac.jp)

## Research Area

1. 先進的な計測技術の開発
2. ミクロからマクロに到る解析技術の開発
3. 1と2の高度な連携による次世代設計コンセプトの開発

例えば,

- a. 固体及び流体の各スケールにおけるコンピュータシミュレーションを用いた仮想試験および実験との詳細による妥当性検証
  - b. 新規先端材料の**即時**特性評価
  - c. 三次元造形やVRを含むデジタルデータベースのオンデマンド製造及び可視化
- をもちいた製品設計の枠組みの創成



## Recent Activities

- Multiscale Stochastic Analysis of a Resin Structure Manufactured by FDM method, UNCECOMP2017, 2017